

全晶圆半导体参数非接触测试解决方案

Full-wafer Noncontact Measuring Solutions for Semiconductor Parameters

基于我公司自主研发的激光自动聚焦、自动化显微成像、宽场荧光成像、共焦光致发光光谱和共焦拉曼光谱等核心测试技术和模组，联合白光干涉等其它 3D 测量技术，根据客户的需求灵活组合相应的技术搭配，为客户开发定制化的半导体参数测试解决方案，获得从粗糙度、图形尺寸和膜厚等几何参数，到位错、层错等缺陷，再到发光波长、寿命、载流子浓度、组分和应力等物理参数的综合测量，实现无需任何前处理的全晶圆无损自动化检测。



Zolix
卓立汉光

北京卓立汉光仪器有限公司成立二十五周年

25th
逐光而行 将致致远
Lighting Steps to Future

TEO
先锋科技
Titan Electro-Optics

3大板块产品

光谱与影像产品

工业光电与精密机械

激光与测量产品



关注了解更多



知名光电产品集成商



一键触达光电臻品